

2017. 10 24 (화) 용인 양지 파인 리조트 11층 파인 홀

초대의 말씀

사단법인 한국반도체테스트학회 에서 테스트 기술자 간의 더 많은 교류의 기회 제공과 유익한 토론의 장을 마련하고자 "인공지능/빅데이터 소개 및 응용사례 & 테스트 데이터의 제품 품질 예측/구분 활용 가능성"란 주제로 2017 테스트 기술 워크숍을 개최하게 되었습니다.

이런 기회를 통하여 테스트 관련 모든 학계/업계가 또 다시 한자리에 모여 미래를 함께 고민하고 반도체 테스트 분야가 앞으로 가야 할 길을 모색할 수 있는 좋은 계기를 마련하고자 합니다.

이번 워크숍을 위해 물심양면으로 도움을 주신 학계, 연구소, 그리고 관련 기관의 모든 분들께 감사의 말씀을 드리며, 테스트 및 관련 분야에 기여하시는 모든 분들과 많은 회원님들의 유익한 교류의 장이 될 수 있도록 큰 관심과 참여 부탁드립니다.

2017년 10월

사단법인 한국반도체테스트학회
회 장 강 성 호

워크숍 개요

- ❖ 일 시 : 2017년 10월 24일(화) pm 2:00
- ❖ 장 소 : 용인 양지 파인 리조트 11층 파인홀
- ❖ 주 최 : 사단법인 한국반도체테스트학회
한양대 IDEC Platform Center

워크숍 프로그램

14:00~14:10	개 회 식	사 회 : 박성주(한양대학교)
14:10~15:20	Exploiting k-nearest neighbor information with many data 노영균(서울대학교) - 서울대학교 대학원 졸업 - 서울대학교 기계공학과 부교수	좌 장 : 박성주(한양대학교)
15:30~16:40	테스트결과 Data에 따른 제품의 품질예측 품질 구분 방법 가능성 정신영(삼성전자) - 2004년 University of Florida 졸업 - 2004년 ~ 현재 삼성전자/DS 총괄/Foundry 사업부/제품기술팀 재직	좌 장 : 김병호(한양대학교)
16:50~18:00	제품의 품질 예측을 위한 통계 분석 활용 김홍진(SK하이닉스) - 2003년 한양대학교 대학원 졸업 - 2003년 ~ 현재 SK하이닉스 재직	좌 장 : 양준성(성균관대학교)
18:00 ~	폐 회 식	사 회 : 안진호(호서대학교)

워크숍 등록안내

등 록	사 전 등 록	현 장 등 록
날 짜	2017. 10. 10(화) 이전	2017. 10. 24(화) 당일
회원사 평생회원 정회원 학생회원	무료	무료
비 회 원	5만원	7만원
	◆ 납부 방법 : 입 금 계 좌 : 하나은행 128-910006-25304 예 금 주 : 한국반도체테스트학회	

- 등록비 입금 후 작성하신 참가등록신청서를 학회사무국 메일(info@koreatest.or.kr)로 보내주시기 바랍니다.
- 참가등록 신청서는 한국반도체테스트학회 홈페이지(<http://www.koreatest.or.kr>) 공지사항 게시판에서 다운 받으실 수 있습니다.

워크숍 오시는 길



- 주 소
경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 34-1
- TEL. 031-338-2001

지가용이용시	경부고속도로	영동고속도로	양지파인리조트
1	경부고속도로 신갈 J.C	영동고속도로 양지 IC	양지파인리조트
2	경부고속도로 신갈 J.C	수원, 용인간 국도	양지사거리 양지파인리조트
3	중부고속도로 호법 J.C	영동고속도로 양지 IC	양지파인리조트

문의처

- ▶ 담 당 : 한국반도체테스트학회
- ▶ T E L : 02-313-3705
- ▶ F A X : 02-363-8389
- ▶ E - mail : info@koreatest.or.kr